# 核素分析

实验者: 余钊焕 合作者: 朱 可 (中山大学理工学院, 物理学专业 2006 级, 学号 06324043) 2009 年 3 月 24 日

# 【实验目的】

- 1. 熟练掌握 NaI (Tl) 闪烁 γ 谱仪的使用方法。
- 2. 测量标准样品和自制样品的 γ 谱曲线。
- 3. 采用逆矩阵法分析 Th、Ra、K 等放射性核素的含量。

# 【实验仪器】

NaI (Tl) 闪烁探头、高压电源、多道脉冲幅度分析器、计算机、标准样品5个、刻度用放射源 <sup>60</sup>Co 或 <sup>137</sup>Cs。

实验装置如图 1 所示。

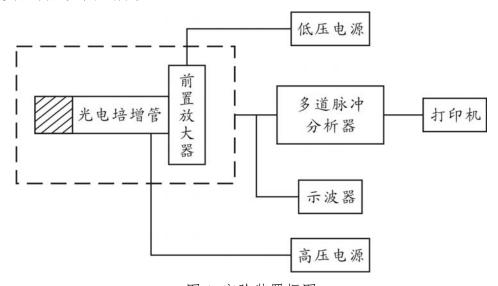


图 1 实验装置框图

# 【实验原理和分析方法】

NaI (Tl) 闪烁谱仪由 NaI (Tl) 闪烁体、光电倍增管、射极输出器和高压电源 以及线性脉冲放大器、单道脉冲幅度分析器(或多道分析器)、定标器等电子学 设备组成。这种谱仪既能对辐射强度进行测量,又可作辐射能量的分析,同时具 有对 γ射线探测效率高(比 G-M 计数器高几十倍)和分辨时间短的优点,是目前广泛使用的一种辐射探测装置。

当分析较多放射性核素的混合样品时,由于许多能量的 γ 能谱混杂在一起,由于 NaI 谱仪的分辨率限制,峰与峰之间相互重叠,甚至不能区分,因此需要对复杂能谱进行解析才能确定样品的组成核素和含量。本实验采用逆矩阵法进行解谱,其原理简述如下。

用逆矩阵法解析复杂 γ射线能谱,对各种成分放射性含量比较相近的样品,解谱误差可达 2 %左右,对弱成分误差显著增大。

应用逆矩阵法解谱,要得到准确的结果,必须满足下列条件:

- (1)混合样品中核素都是已知的,这样才可以选定相应的标准样品来建立 标准谱:
  - (2) 测量标准谱和混合样品谱时,谱仪的测量条件要一致,仪器要稳定;
- (3)各单一核素放射性线性叠加情况下,探测系统的脉冲幅度不随计数率 改变;
- (4)混合样品中各核素具有各自的 γ 能谱,并能够选出表征各自能量的特征峰(特征峰上对称于最高计数处的道域称为特征道域)。

测量每个核素标准谱时,不仅要测量它在本身的特征道域中的计数,而且要测出它在其它特征道域中的计数,由此确定各种核素对各个道域计数的贡献,这个贡献用响应系数 *aij* 来表示,其定义为

$$a_{ij} = \frac{\hat{\mathbf{g}}_{j} + \hat{\mathbf{g}}_{j} + \hat{\mathbf{g}}_{j} + \hat{\mathbf{g}}_{j}}{\hat{\mathbf{g}}_{j} + \hat{\mathbf{g}}_{j} + \hat{\mathbf{g}}_{j}},$$
 (1)

其物理意义是单位衰变率的第 i 种在第 i 道域上所能引起的计数率。

对于混合样品,设其第 j 种放射性核素的活度为  $x_j$ ,则第 j 种成分在第 i 道域中的计数率贡献是  $a_{ij}x_j$ 。因此混合样品在第 i 道域的计数率  $m_i$  ( $i=1,2,\ldots,n$ )为各种核素分别在该道域的计数率之和,即

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_{j} = m_{i}, \quad i = 1, 2, ..., n,$$
(2)

这样就得到一个由n个方程组成的n元联立方程组。

将方程组(2)改写成矩阵形式 AX = M,A 为  $a_{ij}$  集合而成的矩阵,称为谱仪的响应矩阵,X 为未知量  $x_{ij}$  组成的列矩阵,M 为样品在各道域的计数率组成的列矩阵。方程(2)的解为  $X = A^{-1}M$ ,即

$$x_{j} = \sum_{i=1}^{n} a^{-1}{}_{ji} m_{i}, \qquad (3)$$

其中记号 $a^{-1}_{ji}$ 表示矩阵 $A^{-1}$ 的矩阵元。因此,由实验测定A,求得 $A^{-1}$ ,再把测得混合样品在各特征道域上的计数 $m_i$ 代入(3)式,就可以确定混合样品中各核素

的放射性活度 xi。

逆矩阵法对某核素的分析精度,取决于在它的特征道域中该核素计数在样品总计数中所占的份额。该核素计数在样品总计数中所占份额越大,则它的分析精度也越高。因此,各核素的特征道域应尽量选在该核素计数相对强度大、其它核素计数贡献少的全能峰上。另外,γ能量低的核素的特征道域,如果选在γ能量高的核素的康普顿坪上,特征道域的宽度就不宜取得太宽。但考虑到仪器增益和阈漂移的影响,特征道域的宽度也不能取得太窄,一般取特征道域的宽度为几十keV。

被测样品在各特征道域上的计数和谱仪本底都会有统计涨落,并通过逆矩阵计算互相传递。假如标准谱的测量精度足够高,使响应系数的误差可以忽略,根据误差理论可以推算出第i成分含量 $x_i$ 的标准误差 $\sigma_{x_i}$ 为

$$\sigma_{xj} = \frac{1}{\sqrt{t}} \sqrt{\sum_{j'} \sigma_{jj'} x_{j'} + B_j} , \qquad (4)$$

其中, $\sigma_{jj'} = \sum_{i} \left(a^{-1}_{ji}\right)^{2} a_{ij'}$  为第 j' 成分计数统计涨落对第 j 成分的误差贡献因子,当 j = j'时,表示第 j 成分自身统计涨落的误差贡献因子;  $B_{j} = 2\sum_{i} \left(a^{-1}_{ji}\right)^{2} b_{i}$ ,此处 $b_{i}$ 为第 i 道域的本底计数率;t 为样品测量时间。

根据(4)式可以确定各核素分析结果的统计误差。为了降低统计误差,可以适当延长测量时间。此外,结果误差随着混合样品中核素数目的增加而增大,因此实际应用时混合样品中的核素数目一般不超过5个。

## 【实验步骤】

- 1. 测量放射源的 γ射线能谱, 选择合适的工作条件。
- 2. 粗测样品的能谱,在给定的峰道计数统计误差内确定各能谱的测量时间。
- 3. 在选定的实验条件下,测量标准谱、混合样品谱和本底谱。
- 4. 用逆矩阵法分析。

#### 【测量数据和数据处理】

各样品的标称值如下。

## 标准样 40K:

盒重 70.1 g,总重 365.6 g,净重 295.5 g,活度 423.2 Bq,3.5 %,k = 2。 标准样 <sup>226</sup>Ra:

盒重 71.9 g, 总重 310.5 g, 净重 238.6 g, 活度 133.1 Bq, 3.5 %, k = 2。

## 标准样 <sup>232</sup>Th:

盒重 71.8 g, 总重 330.5 g, 净重 258.7 g, 活度 80.7 Bq, 3.5 %, k = 2。 混合样:

盒重 70.2 g, 总重 320.0 g, 净重 249.8 g, 其所含各核素活度如下,

设置测量时间为 3600 s,道数为 1024,测量  $^{232}$ Th、 $^{226}$ Ra、 $^{40}$ K 标准样、混合样及本底的  $\gamma$  谱。根据  $^{232}$ Th、 $^{226}$ Ra、 $^{40}$ K 标准样  $\gamma$  谱的特征,选取  $^{232}$ Th、 $^{226}$ Ra、 $^{40}$ K 的特征峰分别位于第 77 道、第 123 道和第 526 道,特征道域均取为 9 道。测量得到的  $^{232}$ Th、 $^{226}$ Ra、 $^{40}$ K 标准样、混合样及本底在各特征道域的计数如表 1 所示。

<sup>232</sup>Th <sup>226</sup>Ra  $^{40}$ K 样 品 混合样 本底 72-80 道的计数 7942 13236 2193 18495 1670 119-127 道的计数 2957 10707 1327 12310 1125 522-530 的计数 596 790 1481 1745 473

表 1 各特征道域的计数

将上表中<sup>232</sup>Th、<sup>226</sup>Ra、<sup>40</sup>K 标准样和混合样的各道域计数扣去本底计数,再除以测量时间 3600 s,得到各个样品在各特征道域的计数率,如表 2 所示。

样品	<sup>232</sup> Th	<sup>226</sup> Ra	$^{40}$ K	混合样	本底
72-80 道的计数/s <sup>-1</sup>	3.213	1.742	0.145	4.674	0.464
119-127 道的计数/ s <sup>-1</sup>	0.509	2.662	0.056	3.107	0.312
522-530 的计数/ s <sup>-1</sup>	0.034	0.088	0.280	0.353	0.131

表 2 扣除本底后各特征道域的计数率

利用上表数据、各标准样的标称活度,代入式(1),求得响应矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3.98 \times 10^{-2} & 1.31 \times 10^{-2} & 3.43 \times 10^{-4} \\ 6.31 \times 10^{-3} & 2.00 \times 10^{-2} & 1.33 \times 10^{-4} \\ 4.23 \times 10^{-4} & 6.62 \times 10^{-4} & 6.62 \times 10^{-4} \end{pmatrix} s^{-1} \cdot Bq^{-1},$$

其逆矩阵为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 28.1 & -18.0 & -11.0 \\ -8.80 & 56.0 & -6.65 \\ -9.18 & -44.4 & 1.52 \times 10^3 \end{pmatrix} \mathbf{s} \cdot \mathbf{Bq} ,$$

混合样品在各道域的计数率 mi 组成的列矩阵

$$M = \begin{pmatrix} 4.674 \\ 3.107 \\ 0.353 \end{pmatrix} s^{-1},$$

从而,可求得各种放射性核素的活度 xi 组成的列矩阵

$$X = A^{-1}M = \begin{pmatrix} 28.1 & -18.0 & -11.0 \\ -8.80 & 56.0 & -6.65 \\ -9.18 & -44.4 & 1.52 \times 10^{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4.674 \\ 3.107 \\ 0.353 \end{pmatrix} Bq = \begin{pmatrix} 71.41 \\ 130.48 \\ 357.88 \end{pmatrix} Bq$$
,

再由式 (4) 第i成分含量 $x_i$ 的标准误差 $\sigma_{x_i}$ 为

$$\left(\sigma_{xj}\right) = \begin{pmatrix} 1.3\\1.9\\20.1 \end{pmatrix} \operatorname{Bq} \, .$$

综上,用逆矩阵法进行解谱,得到混合样品中各种放射性核素的活度分别为:

$$x_{232}$$
Th 的活度  $x_{232}$ Th 的活度  $x_{232}$ Th 的活度  $x_{226}$ Ra 的活度  $x_{226}$ Ra 的活度  $x_{40}$ K 的活度  $x_{40}$  = 357.9 ± 20.1 Bq

与混合样品各核素活度的标称值比较, <sup>40</sup>K 的活度相符, <sup>232</sup>Th 和 <sup>226</sup>Ra 的活度有微小偏离。

此外,利用计算机软件 WinNaI,对混合样品的  $\gamma$  能谱进行最小二乘法分析,得到的结果如表 3 所示。

表 3 WinNaI 对混合样品各核素比活度的分析

核 素	核素所占计数	比活度 (Bq/kg)	不确定度
<sup>232</sup> Th	103327	309.61	4.56%
<sup>226</sup> Ra	136729	511.69	4.33%
$^{40}\mathrm{K}$	12764	1336.31	6.20%

再由混合样的净重 249.8 g, 求得混合样品各核素的活度分别为:

$$x'_{232}$$
Th 的活度  $x'_{232}$ Th 的活度  $x'_{232}$ Th

 $^{226}$ Ra 的活度  $x'_{^{226}Ra} = 127.8 \pm 5.6$  Bq

 $^{40}$ K 的活度  $x'_{_{40_{K}}} = 333.8 \pm 20.7$  Bq

与混合样品各核素活度的标称值比较, $^{232}$ Th 的活度相符, $^{226}$ Ra 和  $^{40}$ K 的活度有微小偏离。

## 【讨论】

上面分别用逆矩阵法和 WinNaI 的最小二乘法进行解谱,两种方面给出的结果有所不同,并且都与标称值有微小偏离。由此可见,不同的解谱方法一般会得出略为不同的结果,因此我们要注意在各种具体的实验条件下采取适当的解谱方法,才能得到比较精确的测量结果。

由于放射性计数的统计性,在相同的条件下,每次测量的结果也并不完全相同,而是围绕其平均值上下涨落,有时甚至有很大的差别。本实验的测量时间为3600 s,而所用各个样品的各种放射性核素的活度均比较低,因此测量精度不可能很高,得到的结果与标称值有所偏离是不足为奇的。对于同样这些样品,若要提高测量的精度,可以通过延长测量时间来达到目的,比如将测量时间延长为7200 s 等。

### 【思考题】

1. 逆矩阵法解谱的条件是什么? 这些条件在实验中应如何保证?

答: 逆矩阵法解谱的条件有: (1) 混合样品中核素都是已知的,这样才可以选定相应的标准样品来建立标准谱; (2) 测量标准谱和混合样品谱时,谱仪的测量条件要一致,仪器要稳定; (3) 在各单一核素放射性线性叠加的情况下,探测系统的脉冲幅度不会随着计数率的改变而改变; (4) 混合样品中各核素具有各自的 γ 能谱,能够从中选出表征各自能量的特征峰。

为了保证逆矩阵解谱法能够适用,在本实验中,在测量 5 个样品的过程中实验条件都是固定的,选取的各个核素具有比较明显的特征峰。

2. 各特征道域应如何选取? 道域取得太宽或太窄对分析结果有什么影响? 答: 各核素的特征道域应尽量选在该核素计数相对强度大、其它核素计数贡献少的全能峰上。

假如道域取得太宽,容易导致对  $\gamma$  能量低的核素的测量精确度下降;假如道域取得太窄,由于仪器增益和阈漂移的影响,标准样  $\gamma$  谱的特征峰位置与混合样  $\gamma$  谱的对应峰位置可能会对不上,从而导致测量不精确。